1.Check Intensity：①Average value：633.333 Uniformity（≤2.5％）1.720

2.Light source energy（mj）：①100msec：50.1 ②200msec：100③：400msec：199.9④800msec：399.5

3.flatness test：①Max-Min（≤3um）：1.910 Local flatness（≤1um）：0.790，

4.BST test（≤0.5um）：-0.001

5.chip leveling：①X(≤1.5sec):-0.48 ②：Y（≤1.5sec）: 0.464

6.STEPPING（≤0.08um）:X:0.029/Y:0.030

7.Pre-alignment：Average（X:-25.229/Y:-9.215/T:-0.669）;

 3δ(X:3.996/ Y:3.960/T:2.603）

8.Reticle rotation ：abs（≤20nm）：57 3δ（≤20nm）：4

update VRA R ROT. 4.763 to -0.904

Reticle rotation Abs:（≤20nm）:9 3δ:3（≤20nm）:3

9.ORT ORTM :0.096

 ORTM90:0.038

 ≤0.1：0.014sec

10.Reticle blind setting accuracy;

XL (﹢0.4 to ﹢0.8mm): 0.620(+0.4to0.8mm)

XR (﹢0.4 to ﹢0.8mm): 0.650(+0.4to0.8mm)

YL (﹢0.4 to ﹢0.8mm): 0.650(+0.4to0.8mm)

YR (﹢0.4 to ﹢0.8mm)：0.700(+0.4to0.8mm)

11.DIstortion ：

 X MIN:-52

 X MAX :56

 Y MIN :-28

 Y MAX:32

12.Overlay FIA: X（Mean+3δ）：83 Y（Mean+3δ）:71

13.overlay ：

 X Mean= 24.6 Y Mean= -66.9

 X 3δ= 250.7 Y 3δ= 127.9

 X（Mean+3δ）= 275.3 Y（Mean+3δ) = 194.7

# Item Name Measurement

Tran X[nm]: 25.7446 Tran Y[nm]:-66.2654

Exp X[nm] : -0.2555 Exp Y[nm]: -0.2269

Rot-X[urd]: -0.1287 Rot-Y[urd]: -0.0471

R Mag[ppm]: -2.5464

R Rot[urd]: -6.3928

Tran X：-0.330→-0.35 Tran Y：-0.286→-0.226

Rot：9→15 Rmag：0.065→0.09

 X（Mean+3δ）= 147.8 Y（Mean+3δ) = 107.3

DIS

MAX X :0.056 Y:0.032 MIN X:-0.052 Y:-0.028

INC UR-LL :-0.015 UL-LR:-0.055